

次级宇宙线原子核

次级宇宙线原子核 Li, Be, B, F 为初级宇宙线 C, O, Ne, Mg, Si, ..., Fe 和星际物质的相互作用产物。



次级宇宙线流强谱及其与初级宇宙线流强谱的比值的精确测量对理解宇宙线传播机制非常重要。

AMS宇宙线初、次级轻原子核流强谱结果



次级宇宙线原子核的能谱变硬程度大于初级宇宙线原子核。

AMS宇宙线初级较重原子核流强谱结果(Ne, Mg, Si)



目前测量的宇宙线初级原子核可按能谱形状分为两组: He, C, O 和 Ne, Mg, Si 宇宙线更重次级原子核的能谱形状? 4

AMS 对宇宙线氟原子核的测量

Tracker(9层) + 永磁体: 刚度(动量/电荷)



	偏转方向位置分辨	MDR
Z =1	10 µm	2 TV
2≤Z≤8	5-7 μm	3.2-3.7 TV
Z=9	8 µm	3 TV

TOF(4层):速度和方向 Δβ/β²≈4% (Z=1) Δβ/β²≈1-2%(Z≥2)

L1, UTOF, Inner Tracker(L2-L8), LTOF, L9:电荷 (相互独立)

	Tracker L2-L8 电荷分辨	(c.u.)
1≤Z≤8	ΔZ ≈ 0.05-0.12	
Z=9	ΔZ ≈ 0.13	

氟原子核事例的选取



氟原子核事例的本底估计(1)

用 Inner Tracker(L2-L8)和上层TOF(UTOF)电荷测量值选取氟原子核事例, Tracker L1之下的本底来自于在TRD或UTOF上碎裂的更重的原子核事例,可以 通过对L1的电荷信号的的模板拟合进行精确估计。 ----- Tracker L1的电荷cut范围



氟原子核事例的本底估计(2)

另一部分本底来自于在Tracker L1 或其上支撑结构(主要成分为碳,铝的蜂窝板) 发生碎裂的更重原子核,这部分本底可由Monte Carlo结合AMS更重原子核流 强谱测量结果进行估计。模拟的原子核相互作用截面与AMS数据的测量结果 一致。

利用数据测量原子核相互作用截面:

- 1. 用L1测量的电荷选取初始的原子核事例。
- 2. 利用Tracker L2-L8测量初始原子核碎裂成不同原子核的概率, 结合探测器物质的量得到相应的相互作用截面。





AMS测量结果与其他实验的对比



9

AMS宇宙线氟、硼原子核流强的对比



宇宙线F/Si流强比与B/O流强比的比较



对F/Si 原子核流强比拟合: ${C(R/175 \text{ GV})^{\Delta_1}, R \le 175 \text{ GV}, C(R/175 \text{ GV})^{\Delta_2}, R > 175 \text{ GV}.$ F/Si 原子核流强比在175GV之上 幂指数($\Delta_2^{F/Si} - \Delta_1^{F/Si}$)增加 0.15±0.07。和次初级宇宙线 原子核流强比Li/C, Be/C, B/C, Li/O, Be/O以及B/O的结果一致

(F/Si)/(B/O)的拟合:

 $\frac{\mathrm{F/Si}}{\mathrm{B/O}} = \begin{cases} k(R/R_0)^{\delta_l}, & R \leq R_0, \\ k(R/R_0)^{\delta}, & R > R_0. \end{cases}$

(F/Si)/(B/O)比值在10GV之上可 用单一幂函数(δ = 0.052±0.007) 拟合,说明较重宇宙线原子核 的传播机制与较轻宇宙线原子 核有所不同。

初次级宇宙线原子核流强谱(AMS He-Si)



总结

- AMS精确测量了次级宇宙线氟(Z=9)原子核的流强谱,测量能 区范围从2.15GV到2.9TV,基于AMS 8.5年(2011.5-2019.10)内 收集的数据。
- 测量结果发现,更重的次初级宇宙线原子核F/Si的流强比随刚度的变化与较轻次初级原子核B/O流强比存在明显差异,在10GV之上,两者的比值(F/Si)/(B/O)可用幂函数 R^δ 拟合(δ = 0.052±0.007),这说明较重宇宙线原子核的传播机制与较轻宇宙线原子核不尽相同。

PHYSICAL REVIEW LETTERS 126, 081102 (2021)

Back up



Flux Measurement

$$\boldsymbol{\Phi}_{i}(\boldsymbol{R}) = \frac{N_{i}}{T_{i}A_{i}\varepsilon_{i}\Delta R_{i}}$$

Φ_i(R): Rigidity Range [2.15,3000]GV

N_i: Selected events(need be corrected with Background and Bin to Bin migration)

- *T_i*: Exposure Time for 8.5 years
- *A_i*: Effective Acceptance
- ε_i : Trigger efficiency and cut efficiency correction (ISS / MC)
- ΔR_i : Bin width